

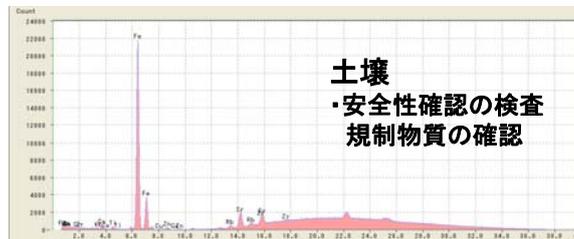
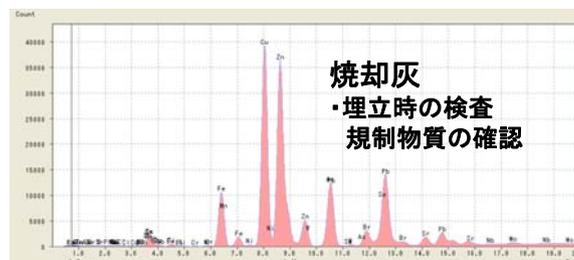
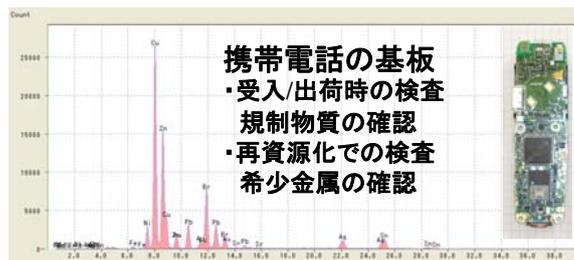
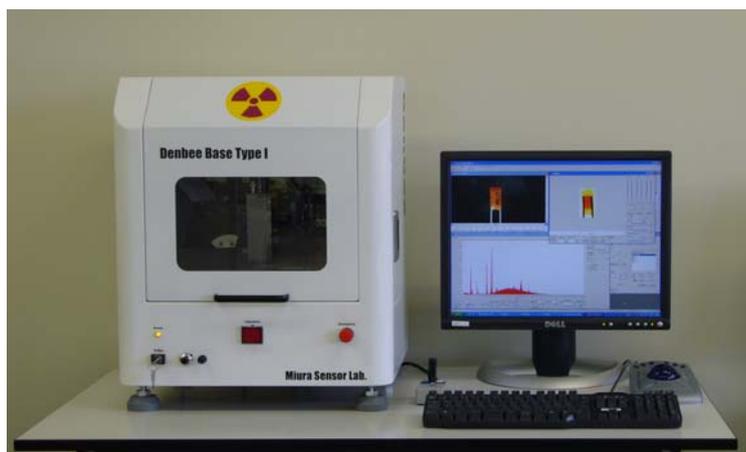
有害元素の見張り番

非接触型有害元素検出装置

Denbee Base[※] Type I

平成19年度
みやぎものづくり大賞グランプリ受賞
機械器具等その他製品部門

※「Denbee Base」は(株)ミウラセンサー研究所の登録商標です。
「Denbee(でんび)」は、東北弁で「額」を意味します。



有害元素の検査ができます。

RoHSや玩具規制に対応した重金属等の検査が可能です。
蛍光X線分析機能を備えた装置です。

調べたい物を即座に評価できます。

試料をそのまま試料台に置いて測定できます。
最短10秒の測定で試料に含まれる元素が判ります。

異物や汚染の検査ができます。

試料の内部を透視できます。
試料上の元素分布を調べられます。

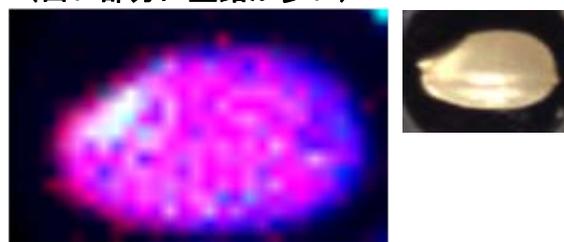
操作が容易です。

測定したい位置をカメラ画像上から選択できます。
使用に特別な資格は不要です。

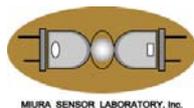
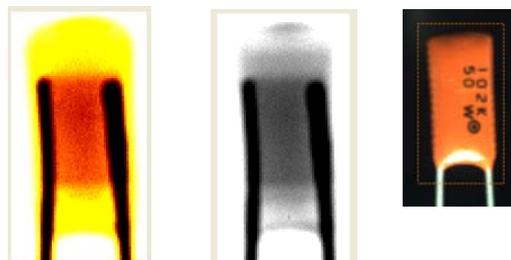
要求に合わせて仕様変更します。

紫外線・可視光線・赤外線での測定用に変更可能です。
多様なセンサーと組み合わせた測定に対応します。
現場の特別な要求に合わせた仕様変更に対応します。

玄米に含まれる亜鉛の分布
(白い部分に亜鉛が多い)



電子部品の透視
(内部の構造が見える)



MIURA SENSOR LABORATORY Inc.

MIURA SENSOR LABORATORY, Inc.

非接触型有害元素検出装置

Denbee Base Type I

「Denbee Base」は株式会社ミウラセンサー研究所の登録商標です。



主な仕様

X線計測仕様		共通仕様	
顕微鏡機能	透過X線像・蛍光X線像の取得 (X線の走査とマッピングによる方式)	試料走査範囲	50mm×50mm
分析機能	蛍光X線スペクトルの測定、定性分析 定量分析(検量線法)	試料寸法	50mm×50mm×50mm
対象元素	Si~U	試料重量	最大5kg
X線光源	最大40kV・150μA、空冷式 ターゲットはW/Rh/Mo/Crから選択可	位置決め精度	10μm
用途	検査、スクリーニング、 不良解析、異物解析、材料開発	繰り返し精度	±1μm
X線用検出器	Si-PIN(電子冷却方式)	光学観察 (カラーCCDカメラ)	同軸観察システム 視野 20mm×20mm
試料室雰囲気	大気	制御用コンピュータ	CPU 32Bit、主記憶 512MB OS Windows XP Professional
計測時間	最小10秒(定性分析)	制御用ソフトウェア	マッピング分析、スペクトル分析 画面・プリンタ・ファイルへの出力
漏洩X線量	1μSv/h以下	本体寸法	幅500mm×奥行440mm×高さ610mm
安全装置	インターロック機構、扉SW、鍵付SW X線出力表示灯、非常停止釦	本体重量	約70kg
		電源	AC100V 50Hz/60Hz 1kVA以下

※ 本装置を設置するにあたっては、設置の30日前迄に所轄の労働基準監督署へ設置届出書を提出する事が必要となります。
(中央省庁への設置では人事院への届出、公立機関への設置では各都道府県の人事委員会への届出が必要となります。)
本装置の使用にあたっては、安全な使用に関する講習を受ける事が必要です。

Denbee Baseは多様な計測の要求に対応します。

<p>Denbee Base Type I (X線対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・X線の透過・蛍光で試料を評価する事が可能です。 ・X線対応の光源・光検出器・分光器を装備しています。 ・蛍光X線分析のみに特化したDenbee Base Type Iaもあります。 	<p>Denbee Base</p> <p>測定の基本機能を基盤化しています。 以下、Type I ~ Type IV に共通の機能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・透過光・反射光・蛍光光の測定 ・透過光・反射光・蛍光光の分光分析 ・吸収光度・発光光度による定量分析 ・試料像の可視光での撮影 ・試料像上での測定位置の選択 ・試料上の測定位置の走査 ・測定結果の二次元マッピング像作成 ・測定結果のファイルへの入出力 ・測定・分析結果の報告書作成支援 他、光源・検出器の変更が可能です。 ・赤外線からX線までの計測に対応します。 ・多様なセンサーの装備が可能です。 ・複数のセンサーの同時使用も可能です。
<p>Denbee Base Type II (紫外線対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・紫外線の透過・反射・蛍光で試料を評価する事が可能です。 ・紫外線対応の光源・光検出器・分光器を装備しています。 	
<p>Denbee Base Type III (可視光線対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可視光線の透過・反射・蛍光で試料を評価する事が可能です。 ・可視光線対応の光源・光検出器・光ファイバー分光器を装備しています。 	
<p>Denbee Base Type IV (赤外線対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤外線の透過・反射・蛍光で試料を評価する事が可能です。 ・赤外線対応の光源・光検出器・光ファイバー分光器を装備しています。 	

製造元

株式会社ミウラセンサー研究所

〒985-0874

宮城県多賀城市八幡字一本柳3番12号

さんみらい多賀城・復興団地

TEL 022-385-5109 FAX 022-385-5209

E-mail office@miura-sensor.jp

Home Page <http://www.miura-sensor.jp>



販売